

X線分析研究懇談会 第283回例会

2025年9月24日（水）～26日（金）に北海道大学札幌キャンパスにて開催される「日本分析化学会第74年会」（<https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jsac74nenkai>）の期間中、日本分析化学会 X線分析研究懇談会による講演会（第 283 回例会）を開催いたします。懇談会会員・非会員を問わず、多くの方のご参加をお待ちしております。

日時：2025年9月24日（水）
16:30～17:00

会場：北海道大学工学部・C309講義室（I会場：【X線分析研究懇談会】）
〒060-8628 北海道札幌市北区北13条西8丁目
<https://www.eng.hokudai.ac.jp/access/>

講演者：高草木達 教授
（北海道大学 触媒科学研究所）

題目：「偏光全反射蛍光XAFS法による表面反応プロセスのその場/オペランド計測」

講演番号：I1107C

本講演のみをご聴講の場合は年会への参加登録・事前登録は不要です。

問合せ先：徳島大学 理工学部 理工学科 自然科学コース
山本 孝
(takashi-yamamoto.ias@tokushima-u.ac.jp)